# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number: 03-094863

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing: 02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

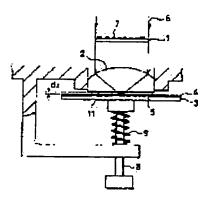
MATSUBARA TAKASHI

### (54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic—treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic—treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic—treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平4-305917

(43)公問日 平成4年(1992)10月28日

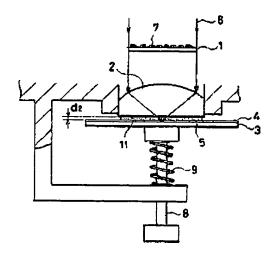
(51)IntCL <sup>5</sup> H 0 1 L 21/027	識別配号	庁内整理番号	F 1			技術表示箇所
		7013—4 <u>M</u> 7352—4M	H01L	21/30	341 S 311 A	
			!	審査請求 未請	漆 - 萧求項の	数1(全 3 頁)
(21) 出顯語号	特膜平3-94863		(71)出膜人	990004112 株式会社ニコ	· .	
(22)出版日	平成3年(1991)4	月2日		東京都千代田		目2番3号
			(72)発明者	大関 尚夫 東京都品川区 会社ニコン大		6番3号 株式
			(72) 発明者		•	克森 号 卷式
			(74)代理人	弁種士 山川		
			1			

## (54) 【発明の名称】 密着型魔光技麿

#### (57) 【要約】

【目的】 密着型扇光装置において、浸液の膜厚を薄く して光の吸収量を少なくし、露光ムラを軽減的止するこ とを目的とする。

【樹成】 電光レンズの密着面11をアルコール等の親水溶液によって親水化処理する。この親水化処理された密着面11にフォトレジスト4を整布されたウエハ3を 起被5を介して密着させ、照射光6の無射によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転写する。 親水化処理された密着面11は、吸水性が向上し、浸液5の腺厚を薄くする。



(2)

特開平4-305917

#### 【特許請求の範囲】

【開求項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ 八杏肴面を親水化処理し、この親水化処理された杏肴面 にフォトレジストを盤布されたウエハを浸液を介して密 着させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを 前紀フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密着型舞光装団。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 10 いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に役割席光 する野光滅窟、特に密着国郡光被置に関するものであ

#### [0002]

【従来の技術】レーザー光等を限射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウェハ等の半導 体基板上に投影器光するこの語の露光装置における露光 方式としては、①密着 (コンタクト) 個光方式、②プロ キシミティ爾光方式、③反射型投影露光方式、④縮小レ ンズ役形摩光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着露光方式は、フォトマスク (または投影光学系) とウエハとを密着させて観光する もので、これらが完全に審着している場合には、フォト レジスト中の波長が風折率分の1に短くなるため、回折 の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密管を実現することは極 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に誇 触させているためにウエハ衰面の突起等によりフォトマ スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩留りに影響を及ばすといった問題があった。

【0004】そこで、密着露光方式によるこのような問 題を解決する方法としてフォトマスクとウェハ間に被体 (浸酸)を充填している。図2は投影光学系にウエハを 香着させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は 投影光学系の一部を構成する鰹光レンズ、3はフォトレ ジスト4が途布されたウエハ、5は意光レンズ2とウエ ハ3間に充填された侵族、6はフォトマスク1のパター ン?を照射しフォトレジスト4を解光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 である。照射光6の改長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー 装置が用いられる。 浸液 5 としては、 屈折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を溶かさないものが望ましく。 通常純水が使用 される。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し たような受被5を使用した密考型מ光线圏においては、

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト意光されたフ オトレジスト4のパターンが的確に露光されている部分 とそうでない部分とが至じてしまうという問題があっ た。したがって、このような露光ムラの発生を防止する ため、侵被5の奠厚は1を薄くし、光の吸収ムラを少な くすることが設まれている。

【0006】本発明は上途したような従来の問題点およ び要望に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、浸液の膜厚を薄くし、露光ムラを軽減防止し得るよ うにした密着型隊光装置を提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウェハ密 帝国を観水化処理し、この親水化処理された密着面にフ オトレジストを塗布されたウエハを浸液を介して密着さ せ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前記 フォトレジストに転写するようにしたものである。

#### [0008]

【作用】本発明において、糧水化処理された投影光学系 もしくはフォトマスクのウエハ密着画は、吸水性が向上 し、反液の膜原を薄くする。

#### 100091

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る密着型は光装置の 一実施何を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一構成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。本実施例は投影光学系にウエハを密 着させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の 一部を構成する露光レンズ2のウエハ密着面11を予め 30 親水化処理し、この親水化処理された密岩面11にウエ ハ3を施水等の侵続5を介して密着させ、照射光6の展 射によりフォトマスク1のパターン7をウエハ3上に転 写するようにしたものである。

【0010】 観水化処理は、アルコール系等の額水溶液 で密着面11を奇麗に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる、そして、この親水化処理後密着面 1 1 にウエハ3を浸液5を介して密着させ、ウエハ3を露光 レンズ2にばね9により所定圧にて押しつける。

【0011】かくしてこのような構成においては、親水 レウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 化処理によって密着面11の吸水性を向上させているの で、親水化処理を施さなかったときと比較して浸液5の 吸水効果が大きく、したがって、浸液5の表面張力が小 さくなって濡れ性が上がるため、浸破るの態厚は2 を図 2に示した従来装置と比較して薄くする (d2 くd1) ことができ、また膜原が深くなれば光の吸収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、経光 ムラを軽減防止することができる。

#### [0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密管型 没被5 自身の腹厚ムラがあると、浸液5 による照射光6 50 露光装置によれば、投影光学系またはフォトマスクのウ

-98-

(3)

特開平4-305917

エハ密曽面を親水化処理し、この親水化処理された密曽 面に、フォトレジストを整布されたウエハを侵袭を介し て密着させるように構成したので、民族自身の表面張力 を減らして濡れ性を向上させることができる。したがっ て、没彼の誤写を導くするかでき、また誤写が落くなれ ば侵骸の膜厚ムラも少なくなるため、光の吸収が少な く、授液による異光ムラを軽減防止することができる。 【図面の簡単な説明】

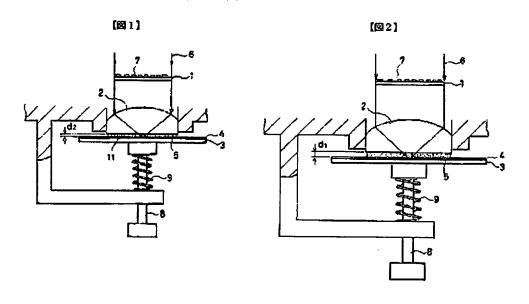
【四1】本発明に係る密着四蘇光装置の一実施例を示す 要部の断面図である。

【図2】密着型電光装配の従来例を示す要略の新面図で

ある.

### 【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 観光レンズ
- ウエハ
- フォトレジスト
- 5 長液
- 殿射光
- 7 マスク
- 10 11 密着面



--99-